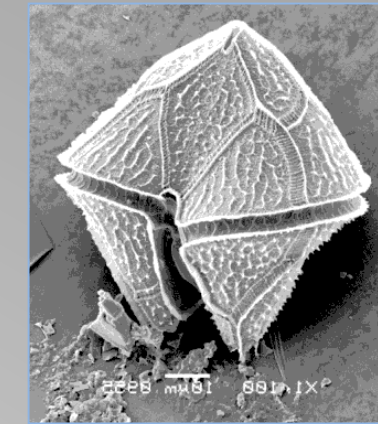


## SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MLP) FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO UNLP

Paseo del bosque s/nº, 1900 La Plata Bs.As Teléf. 0221-4257744, Interno 136  
E-mail: [patsarmi@fcnym.edu.ar](mailto:patsarmi@fcnym.edu.ar)



Este servicio fue Inaugurado el 3 de agosto de 1987, contando con un Microscopio Electrónico de Barrido y metalizador obtenidos por Convenio entre la Perf. Tokushima, Japón- Universidad Nacional de La Plata y la Fac. Cs. Naturales y Museo.



Marca JEOL modelo JSM-T100



Marca JEOL modelo JSM FINE COAT JFC 1100

1994 se compró a través de un subsidio otorgado por la Fundación Antorchas y aporte de la FCNYM-UNLP. Un Equipo de SECADO POR PUNTO CRITICO, marca BAL-TEC modelo CPD 30

2001-2004 a través del subsidio, (FONCYT) otorgado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, con participación de la UNLP y la FCNYM.

2005 inicia el servicio.



Marca JEOL modelo JSM 6390 LV

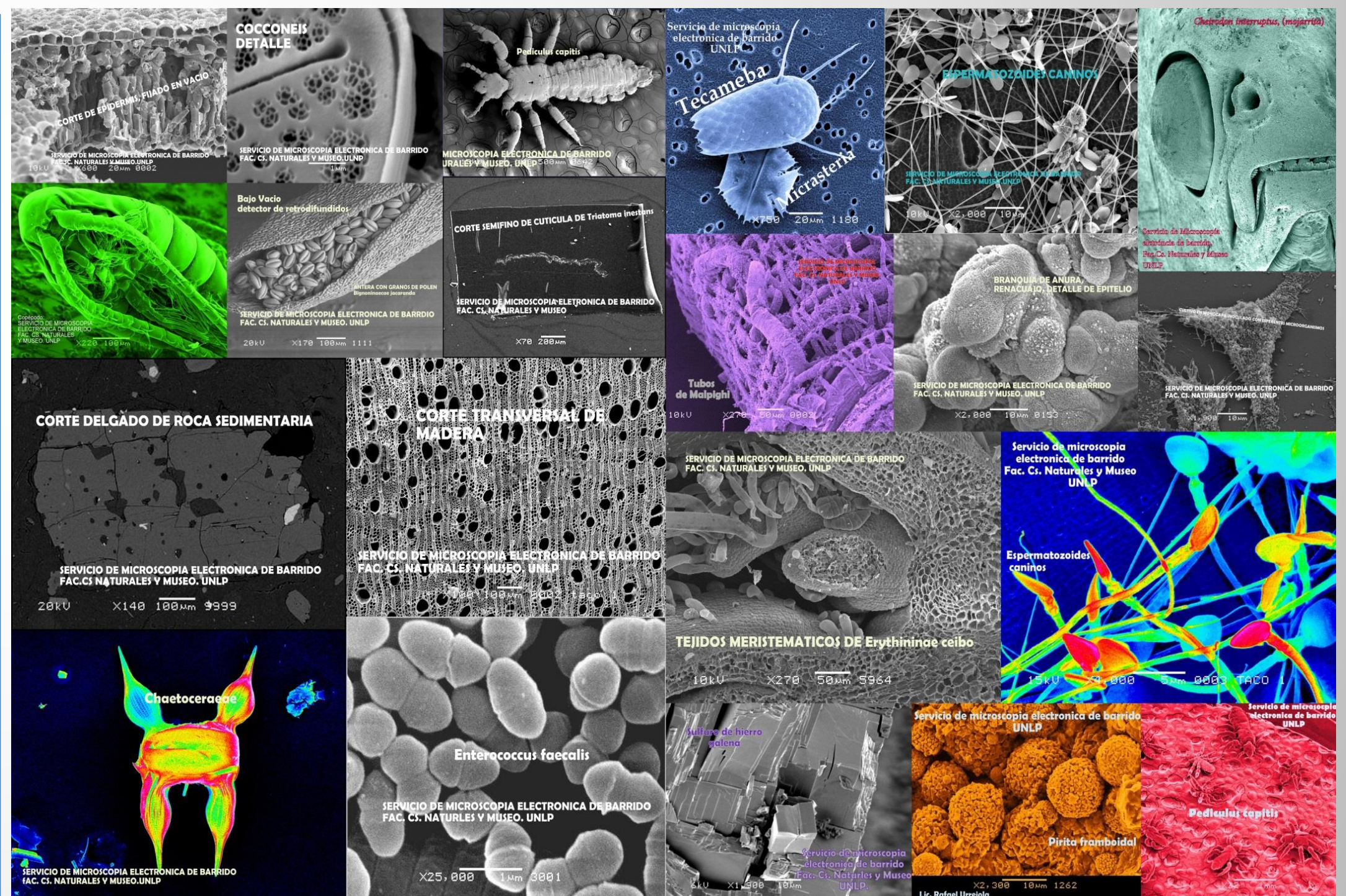
Fueron tomadas más de 100.000 microfotografías desde el inicio de las prestaciones hasta hoy.

Es un servicio arancelado, los 4 tipos de aranceles dependen de la vinculación de los usuarios con la Fac. de Cs Naturales y Museo y la Unv. Nacional de La Plata. La atención consta de un turno de una hora y media de duración, que desde su inicio se autofinanció con lo recaudado por la atención de usuarios, es decir se compran todos los insumos y se realizan anualmente servicio de limpieza de la columna óptica electrónica, cambios de aceites bombas rotativas y difusoras, que lo requieran como así también las reparaciones necesarias de cada uno de los equipos del servicio.

Desde hace 34 años, funciona ofreciendo atención a usuarios especializados en diferentes disciplinas científicas dependientes de la UNLP, o de otras universidades de nuestro país, CONICET, CIC, Empresas privadas, Consultorías.

Biología:	65%
Odontología:	3%
Medicina:	0,5%
Peritajes Judiciales:	0,5%
Químico-Farmacéutica:	0,5%
Metalurgia:	0,5%
Cidca:	5%
Cidepint:	5%
Inifta:	5%
Cindefi:	5%
Lemit:	5%
Consultoras en general:	5%

Se atienden 2 turnos diarios de MEB Y pudiéndose utilizar el servicio de secado por punto crítico también arancelado en 4 categorías.



- Se Digitalizó la toma de microfotografías del microscopio Jeol JSM-T100, no está en funcionamiento. Con la reparación se ampliaría la capacidad de atención de usuarios ya que cubrirían 4 turnos más de MEB.
- Se incorporó una pantalla para el usuario en el Meb Jeol JSM.6360 LV. TAMBIÉN SE REPARÓ LA FALLA EN EL SOFTWARE. Se compró una UPS de 10 KVA.
- Es imprescindible la incorporación de personal que pueda ser capacitado, en la operación, cuidado de los equipos, asesoramiento y asistencia de los usuarios. También contar con un Servicio de procesamiento completo de muestras biológicas arancelado.

**Trabajos publicados:**

<https://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/2506/2447>

<https://www.researchgate.net/publication/318203703> A new method using Scanning Electron Microscopy SEM for preparation of anisopteros odonates DEL PALACIO et al

<https://www.researchgate.net/publication/264439737> Do Lithobates catesbeianus tadpoles acclimatise to sub-lethal copper

**Posters congresos:**

<https://www.researchgate.net/publication/331609133> Poster Bonaura MC Cuba 2017

**Workshop:**

[https://www.youtube.com/watch?v=O\\_X8coS6E9Q&list=PLxkmohFE2aBT\\_cK\\_Wft95FaV4kEBPR5KI&index=14&t=2997s](https://www.youtube.com/watch?v=O_X8coS6E9Q&list=PLxkmohFE2aBT_cK_Wft95FaV4kEBPR5KI&index=14&t=2997s)

**Presentaciones orales Congresos:**

**"Microscopía electrónica de barrido (MEB):**

Restos arqueológicos, análisis estructural, protocolo para limpieza de la superficie de estudio. Patricia L. Sarmiento, Natalia Morales, Gustavo Barrientos. XIII Interamerican Microscopy Congress CIASEM (Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía Electrónica) del 18 al 23 de octubre de 2015, Venezuela isla Margarita



**Prof. Patricia Sarmiento**  
Profesional Principal, CPA CONICET  
[patsarmi@fcnym.unlp.edu.ar](mailto:patsarmi@fcnym.unlp.edu.ar)